

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение вывода
1,5	Балансировка
2	Вход инвентирующий
3	Вход неинвентирующий
4	Напряжение питания минус U _{сс}
6	Выход
7	Напряжение питания U _{сс}
8	Свободный

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
при температуре (25 ± 5)°С

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		(ОСМ)1417УД6АВК (ОСМ)1417УД601АВК (ОСМ)1417УД29АВК (ОСМ)1417УД2901АВК		(ОСМ)1417УД6БВК (ОСМ)1417УД601БВК (ОСМ)1417УД29БВК (ОСМ)1417УД2901БВК		(ОСМ)1417УД29ВВК (ОСМ)1417УД2901ВВК		(ОСМ)1417УД29ГВК (ОСМ)1417УД2901ГВК	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Максимальное выходное напряжение, В	U _{о max}	11,5	-11,5	11,5	-11,5	3,5	-3,5	6,0	-6,0
Напряжение смещения нуля, мВ	U _ю	-5	5	-8	8	-1,0	1,0	-5,6	5,6
Входной ток, нА	I _г	-0,5	0,5	-0,5	0,5	-0,5	0,5	-0,5	0,5
Разность входных токов, нА	I _ю	-0,25	0,25	-0,25	0,25	-0,25	0,25	-0,25	0,25
Ток потребления, мА	I _{сс}	-3,8	3,8	-3,8	3,8	-3,8	3,8	-3,8	3,8
Коэффициент усиления напряжения	A _у	70000	-	50000	-	20000	-	60000	-

Режим измерения – при: U_{сс} = ±15,0 В; R_L=2,0 к Ом.
Для микросхем : (ОСМ)1417УД29В ВК, (ОСМ)1417УД2901В ВК при : U_{сс}=±6,0 В; R_L=2,0 к Ом;
(ОСМ)1417УД29Г ВК, (ОСМ)1417УД2901Г ВК при : U_{сс}=±9,45 В; R_L=2,0 к Ом;

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем :
- золото (для микросхем с длиной выводов 20 мм) –
- золото (для микросхем с длиной выводов 13,5 мм) –
Цветных металлов не содержится.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (Т_{нм}) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных режимах при: U_{сс}=±15,0±10%; R_L=2,0 к Ом; U_о=10,0 В (амплитуда). Для микросхем (ОСМ)1417УД29ВВК, (ОСМ)1417УД2901В ВК при: U_{сс}=±6,0±10%; R_L=2,0 к Ом; U_о=3,0 В (амплитуда)–120000ч . Для микросхем (ОСМ)1417УД29Г ВК, (ОСМ)1417УД2901Г ВК при: U_{сс}=±(9,45±0,45)В; R_L=2,0 к Ом; U_о=3,0 В (амплитуда)–120000ч

Гамма-процентный ресурс (Т_{ру}) микросхем при γ=95% 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т_{см}) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
 - в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
 - под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.
- Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431130.145-03 ТУ, а ОСМ еще и положению ПО.070.052, в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.